

膜厚儀系列

光刻膠塗層厚度測量

白光干涉原理 · 微奈米級厚度和表面形貌測量



產品規格

型號	HUNSON-W025	HUNSON-W036	HUNSON-W045	HUNSON-W081
波長範圍	250-800nm	365-1000nm	450-750nm	810-910nm
厚度範圍	0.01-50um	0.02-70um	0.05-150um	0.05-300um
厚度分辨率	0.1nm	0.1nm	1nm	10nm
重複性偏差*	薄膜模式偏差:0.1nm 厚膜模式偏差:0.015um			
入射角	正入射			
膜層層數	1-100層			
樣品材料	透明或半透明			
測量模式	反射/對射			
光板尺寸	200um *20um			
是否在線	支援在線			
掃描選擇	XY可選			
電源模組	12V3A，P1J標準插頭，2.14X5.54X11mm			
加密狗	軟體加密狗(USB-KEY)			
USB訊號線	TypeB(膜厚儀端)-TypeA(PC端)			
相機	相機/同軸鏡頭為選配零件			
光纖接頭	SM A 905			

*：重複性偏差為在實驗模擬場景下，標準差重複性測量30次得出的偏差波動。

產品尺寸圖(mm)

